第二节 正态总体均值的假设检验

- 一、单个总体均值 # 的检验
- 二、两个总体均值差的检验(t 检验)
- 三、基于成对数据的检验(t 检验)
- 四、小结



一、单个总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 均值 μ 的检验

1. σ^2 为已知, 关于 μ 的检验(Z 检验)

在上节中讨论过正态总 体 $N(\mu,\sigma^2)$

当 σ^2 为已知时,关于 $\mu = \mu_0$ 的检验问题:

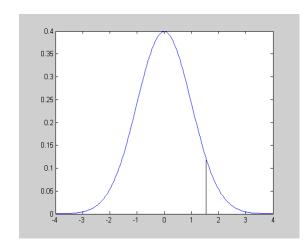
- (1) 假设检验 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$;
- (2) 假设检验 $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$;
- (3) 假设检验 $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$.

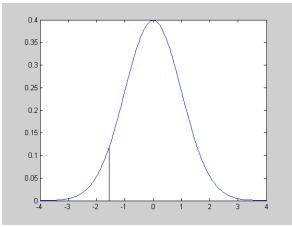


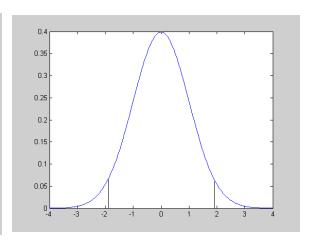
三种假设的拒绝域形式分别见下图:

$$W = \{u \ge c\}$$

$$W = \{u \ge c\}$$
 $W = \{u \le c\}$ $W = \{u \le c_1 \not \equiv u \ge c_2\}$







(a)
$$H_1: \mu > \mu_0$$

(b)
$$H_1: \mu < \mu_0$$

(a)
$$H_1: \mu > \mu_0$$
 (b) $H_1: \mu < \mu_0$ (c) $H_1: \mu \neq \mu_0$



讨论中都是利用 H_0 为真时服从 N(0,1) 分布的统计量 $Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 来确定拒绝域的,这种检验法称为 Z 检验法.

一个有用的结论

当显著性水平均为 α 时,

检验问题 $H_0: \mu \leq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$ 和检验问题

 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$ 有相同的拒绝域.

例1 某切割机在正常工作时,切割每段金属棒的平均长度为10.5cm,标准差是0.15cm,今从一批产品中随机的抽取15段进行测量,其结果如下: 10.4 10.6 10.1 10.4 10.5 10.3 10.3 10.2 10.9 10.6 10.8 10.5 10.7 10.2 10.7 假定切割的长度服从正态分布,且标准差没有变化,试问该机工作是否正常? (α = 0.05)

解 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 0.15$, 要检验假设

$$H_0: \mu = 10.5, \quad H_1: \mu \neq 10.5,$$



$$n = 15$$
, $\overline{x} = 10.48$, $\alpha = 0.05$,

则
$$\frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{10.48 - 10.5}{0.15 / \sqrt{15}} = -0.516$$
,

查表得 $z_{0.05} = 1.645$,

于是
$$\frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = -0.516 < z_{0.05} = 1.645,$$

故接受 H_0 ,认为该机工作正常 .

2. σ^2 为未知, 关于 μ 的检验(t检验)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知, 显著性水平为 α .

求检验问题 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ 的拒绝域 .

设 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本,

因为 σ^2 未知,不能利用 $\frac{X-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 来确定拒绝域 .

因为 S^2 是 σ^2 的无偏估计,故用S来取代 σ ,

即采用 $t = \frac{X - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ 来作为检验统计量 .

当观察值
$$|t| = \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right|$$
 过分大时就拒绝 H_0 ,

拒绝域的形式为
$$|t| = \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \ge k$$
.

根据第六章 § 2定理三知,

定理三

当
$$H_0$$
为真时, $\frac{X-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$,

$$P\{$$
当 H_0 为真,拒绝 $H_0\} = P_{\mu_0} \left\{ \left| \frac{X - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| \ge k \right\} = \alpha$,

得 $k = t_{\alpha/2}(n-1)$,

拒绝域为
$$|t| = \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \ge t_{\alpha/2}(n-1)$$
.

上述利用 t 统计量得出的检验法称为t 检验法.

对于正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$, 当 σ^2 未知时,关于 μ 的单边检验的拒绝域在表 8.1 中给出 .

在实际中,正态总体的方差常为未知,所以我们常用t检验法来检验关于正态总体均值的检验问题.

例2 如果在例1中只假定切割的长度服从正态分布,问该机切割的金属棒的平均长度有无显著变

$$\ell$$
 ($\alpha = 0.05$)

解 依题意 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu, \sigma^2$ 均为未知 ,

要检验假设 $H_0: \mu = 10.5$, $H_1: \mu \neq 10.5$,

$$n = 15$$
, $\overline{x} = 10.48$, $\alpha = 0.05$, $s = 0.237$,

$$|t| = \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{10.48 - 10.5}{0.237 / \sqrt{15}} \right| = 0.327,$$

査表得
$$t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(14) = 2.1448 > |t| = 0.327$$
,

故接受 H_0 ,认为金属棒的平均长度 无显著变化 .

例3 某种电子元件的寿命X(以小时计)服从正态分布, μ,σ^2 均为未知. 现测得16只元件的寿命如

万年, μ , σ 均入不知. 现测得16只元件的寿命外下:

问是否有理由认为元件的平均寿命大于225(小时)?

解 依题意需检验假设

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 225$$
, $H_1: \mu > 225$,



$$\mathfrak{P} \alpha = 0.05$$
, $n = 16$, $\overline{x} = 241.5$, $s = 98.7259$,

t分布表

查表得

$$t_{0.05}(15) = 1.7531 > |t| = \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| = 0.6685$$

故接受 H_0 ,认为元件的平均寿命不 大于 225 小时.



二、两个总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的情况

利用t检验法检验具有相同方差的两正态总体均值差的假设.

设 X_1, X_2, \cdots, X_n 为来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本 $,Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的 样本 ,且设两样本独立 . 注意两总体的方差相等 . 又设 $\overline{X},\overline{Y}$ 分别是总体的样本均值 , S_1^2,S_2^2 是样本方差 , μ_1,μ_2,σ^2 均为未知 ,

求检验问题 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

 $(\delta$ 为已知常数)的拒绝域.

取显著性水平为 α .

引入 t 统计量作为检验统计量:

$$t = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \not\exists r S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

当H₀为真时,根据第六章 § 2定理四知, 定理四



$$t \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

其拒绝域的形式为
$$\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \ge k,$$

得
$$k = t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$$
.

故拒绝域为
$$t = \frac{|(\bar{x} - \bar{y}) - \delta|}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \ge t_{\alpha/2} (n_1 + n_2 - 2).$$

关于均值差的其它两个检验问题的拒绝域见表**8.1**,常用 $\delta = 0$ 的情况 .

当两个正态总体的方差均为已知(不一定相等)时,我们可用 Z 检验法来检验两正态总体均值差的假设问题, 见表8.1.



例4 在平炉上进行一项试验以确定改变操作方法 的建议是否会增加钢的得率, 试验是在同一只平 炉上进行的. 每炼一炉钢时除操作方法外, 其它条 件都尽可能做到相同.先采用标准方法炼一炉,然 后用建议的新方法炼一炉,以后交替进行,各炼了 10炉, 其得率分别为(1)标准方法: 78.1, 72.4, 76.2, 74.3, 77.4, 78.4, 76.0, 75.5, 76.7, 77.3; (2)新方法: 79.1, 81.0, 77.3, 79.1, 80.0, 78.1, 79.1, 77.3, 80.2, 82.1; 设这两个样本相互独立, 且分别来自正态总 $\Phi_N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma^2)$, μ_1,μ_2,σ^2 均为未知 , 问建议的新操作方法能否提高得率?(取 $\alpha = 0.05$)

\mathbf{M} 需要检验假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 > 0$, $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$.

分别求出标准方法和新方法下的样本均值和样本方差:

$$n_1 = 10$$
, $\overline{x} = 76.23$, $s_1^2 = 3.325$,

$$n_2 = 10$$
, $\overline{y} = 79.43$, $s_2^2 = 2.225$,

$$\mathbb{E} |s_w|^2 = \frac{(10-1)s_1^2 + (10-1)s_2^2}{10+10-2} = 2.775,$$

查表可知 $t_{0.05}(18) = 1.7341$,



查表8.1知其拒绝域为 $t \le -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$.

因为
$$t = \frac{\overline{x} - \overline{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = -4.295$$
,

$$\leq -t_{0.05}(18) = -1.7341$$
,

所以拒绝 H_0 ,

即认为建议的新操作方法较原来的方法为优.



附表8.1

例5 有甲、乙两台机床加工相同的产品,从这两台机床加工的产品中随机地抽取若干件,测得产品直径(单位:mm)为机床甲: 20.5, 19.8, 19.7, 20.4, 20.1, 20.0, 19.0, 19.9 机床乙: 19.7, 20.8, 20.5, 19.8, 19.4, 20.6, 19.2

机床乙: 19.7, 20.8, 20.5, 19.8, 19.4, 20.6, 19.2, 试比较甲、乙两台机床加工的产品直径有无显著差异? 假定两台机床加工的产品直径都服从正态分布, 且总体方差相等. $(\alpha = 0.05)$

解 依题意 ,两总体 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma^2)$, μ_1,μ_2,σ^2 均为未知 ,



需要检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

查表可知 $t_{0.05}(13) = 2.160$,

$$t = \frac{\overline{x} - \overline{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{7}}} = -0.265 < 2.160, \text{ 所以接受 } H_0,$$

即甲、乙两台机床加工的产品直径无显著差异.

	原假设 H ₀	检验统计量	备择假设 <i>H</i> ₁	拒绝域
1	$\mu \le \mu_0$ $\mu \ge \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 已知)$	$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \ge z_{\alpha}$ $z \le -z_{\alpha}$ $ z \ge z_{\alpha/2}$
2	$\mu \le \mu_0$ $\mu \ge \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 未知)$	$t = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \ge t_{\alpha} (n-1)$ $t \le -t_{\alpha} (n-1)$ $ t \ge t_{\alpha/2} (n-1)$
3	$\mu_1 - \mu_2 \le \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \ge \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 己知)$	$Z = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$z \ge z_{\alpha}$ $z \le -z_{\alpha}$ $ z \ge z_{\alpha/2}$
4	$\mu_1 - \mu_2 \le \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \ge \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 未知)$	$t = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 2)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$t \ge t_{\alpha} (n_1 + n_2 - 2)$ $t \le -t_{\alpha} (n_1 + n_2 - 2)$ $ t \ge t_{\alpha/2} (n_1 + n_2 - 1)$

三、基于成对数据的检验(t 检验)

有时为了比较两种产品,或两种仪器,两种方法等的差异,我们常在相同的条件下作对比试验,得到一批成对的观察值.然后分析观察数据作出推断.这种方法常称为逐对比较法.

例6 有两台光谱仪I_x,I_y,用来测量材料中某种金属的含量,为鉴定它们的测量结果有无显著差异,制备了9件试块(它们的成分、金属含量、均匀性等各不相同),现在分别用这两台机器对每一试块测量一次,得到9对观察值如下:

x (%)	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
y(%)	0.10	0.21	0.52	0.32	0.78	0.59	0.68	0.77	0.89
d = x - y(%)	0.10	0.09	- 0.12	0.18	- 0.18	0.11	0.12	0.13	0.11

问能否认为这两台仪器的测量结果有显著的差异? $(\alpha = 0.01)$

解 本题中的数据是成对的,即对同一试块测出一对数据,我们看到一对与另一对之间的差异是由各种因素,如材料成分、金属含量、均匀性等因素引起的.[这也表明不能将光谱仪I_x对9个试块的测量结果(即表中第一行)看成是一个样本,同样也不能将表中第二行看成一个样本,因此不能用两样本的t检验法作检验].

而同一对中两个数据的差异则可看成是仅 由这两台仪器性能的差异所引起的. 这样, 局限 于各对中两个数据来比较就能排除种种其他因 素,而只考虑单独由仪器的性能所产生的影响. 表中第三行表示各对数据的差 $d_i = x_i - y_i$, 设 d_1, d_2, \dots, d_n 来自正态总体 $N(\mu_d, \sigma^2)$, 这里 μ_d , σ^2 均为未知 . 若两台机器的性能一样, d_1, d_2, \cdots, d_n 属随机误差 则各对数据的差异 随机误差可以认为服从正态分布, 其均值为零.

要检验假设 $H_0: \mu_d = 0, H_1: \mu_d \neq 0.$

设 d_1, d_2, \dots, d_n 的样本均值 \overline{d} ,样本方差 s^2 ,按单个正态分布均值的 t 检验,知拒绝域为

$$\left|t\right| = \left|\frac{\overline{d} - 0}{s / \sqrt{n}}\right| \ge t_{\alpha/2}(n-1),$$

$$\pm n = 9, t_{\alpha/2}(8) = t_{0.005}(8) = 3.3554, \overline{d} = 0.06,$$

$$s = 0.1227$$
, 可知 $t = 1.467 < 3.3554$, 所以接受 H_0 ,

认为这两台仪器的测量结果无显著的差异.

四、小结

本节学习的正态总体均值的假设检验有:

- 1. 单个总体均值 μ 的检验 — Z 检验;
- 2. 两个总体均值差 $\mu_1 \mu_2$ 的检验 — t 检验;
- 3.基于成对数据的检验 --t 检验;

正态总体均值、方差的检验法见下表

(显著性水平为α)



第三节 正态总体方差的假设检验

- 一、单个总体的情况
- 二、两个总体的情况
- 三、小结



一、单个总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的情况

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu, \sigma^2$ 均为未知 , X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 X 的样本 ,

(1) 要求检验假设: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$,

其中 σ_0 为已知常数 . 设显著水平为 α ,

由于 S^2 是 σ^2 的无偏估计 , 当 H_0 为真时 ,

比值 $\frac{s^2}{\sigma_0^2}$ 在1附近摆动 ,不应过分大于 1或过分小于 1,

根据第六章 § 2, 当 H_0 为真时 , $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0} \sim \chi^2(n-1)$,

取
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$
作为统计量,

拒绝域的形式
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \le k_1$$
 或 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \ge k_2$,

此处 k_1 和 k_2 的值由下式确定 :

 $P\{H_0$ 为真,拒绝 $H_0\}$

$$= P_{\sigma_0^2} \left\{ \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \le k_1 \right) \cup \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \ge k_2 \right) \right\} = \alpha.$$

为了计算方便,习惯上取

$$P_{\sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \le k_1 \right\} = \frac{\alpha}{2}, \ P_{\sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \ge k_2 \right\} = \frac{\alpha}{2},$$

故得
$$k_1 = \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$$
, $k_2 = \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$.

拒绝域为:

$$\frac{(n-1)s^{2}}{\sigma_{0}^{2}} \leq \chi_{1-\alpha/2}^{2}(n-1) \quad \vec{\boxtimes} \quad \frac{(n-1)s^{2}}{\sigma_{0}^{2}} \geq \chi_{\alpha/2}^{2}(n-1).$$

指它们的和集



(2)单边检验问题的拒绝域 (设显著水平为 α)

右边假设检验: $H_0:\sigma^2 \leq \sigma_0^2$, $H_1:\sigma^2 > \sigma_0^2$,

因为 H_0 中的全部 σ^2 都比 H_1 中的 σ^2 要小,

当 H_1 为真时, S^2 的观察值 S^2 往往偏大,

拒绝域的形式为: $s^2 \ge k$.

此处 k 的值由下式确定 :

 $P\{H_0$ 为真,拒绝 $H_0\} = P_{\sigma^2 \le \sigma_0^2} \{S^2 \ge k\}$

$$= P_{\sigma^{2} \leq \sigma_{0}^{2}} \left\{ \frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} \geq \frac{(n-1)k}{\sigma_{0}^{2}} \right\}$$

$$\leq P_{\sigma^2 \leq \sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \geq \frac{(n-1)k}{\sigma_0^2} \right\}.$$
 (因为 $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$)

要使 $P\{H_0$ 为真,拒绝 $H_0\} \leq \alpha$,

只需令
$$P_{\sigma^2 \leq \sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \geq \frac{(n-1)k}{\sigma_0^2} \right\} = \alpha.$$

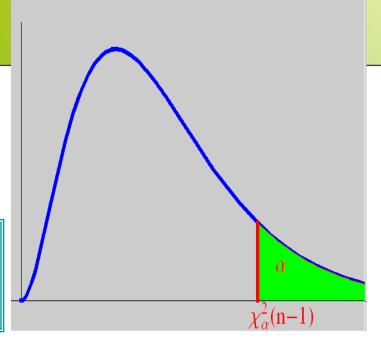
因为
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$
, 所以 $\frac{(n-1)k}{\sigma_0^2} = \chi_\alpha^2(n-1)$,

故
$$k = \frac{\sigma_0^2}{n-1} \chi_{\alpha}^2 (n-1),$$

右边检验问题的拒绝域为

$$s^{2} \ge \frac{\sigma_{0}^{2}}{n-1} \chi_{\alpha}^{2}(n-1),$$

$$\mathbb{RP} \chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \ge \chi_\alpha^2 (n-1).$$



同理左边检验问题: $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$,

拒绝域为
$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \le \chi_{1-\alpha}^2 (n-1).$$

上述检验法称为 χ^2 检验法.

例1 某厂生产的某种型号的电池,其寿命长期以 来服从方差 $\sigma^2 = 5000$ (小时²) 的正态分布,现有一 批这种电池,从它生产情况来看,寿命的波动性有 所变化. 现随机的取26只电池, 测出其寿命的样本 方差 $s^2 = 9200$ (小时²). 问根据这一数据能否推断 这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化? $(\alpha = 0.02)$

解 要检验假设 $H_0: \sigma^2 = 5000$, $H_1: \sigma^2 \neq 5000$, n = 26, $\alpha = 0.02$, $\sigma_0^2 = 5000$,

$$\chi^{2}_{\alpha/2}(n-1) = \chi^{2}_{0.01}(25) = 44.314$$

$$\chi^{2}_{1-\alpha/2}(n-1) = \chi^{2}_{0.99}(25) = 11.524$$

拒绝域为:
$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \le 11.524$$
,或 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \ge 44.314$.

因为
$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{25 \times 9200}{5000} = 46 > 44.314$$
 ,

所以拒绝 H_0 ,

认为这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化.

例2 (续第八章第二节例1)如果只假设切割长度服从正态分布,问该机切割的金属棒长度的标准 差有无显著变化? ($\alpha = 0.05$)

解 因为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均为未知 ,

要检验假设 $H_0: \sigma = 0.15$, $H_1: \sigma \neq 0.15$,

 $\mathbb{P} H_0: \sigma^2 = 0.0225 , \quad H_1: \sigma^2 \neq 0.0225 ,$

$$n = 15$$
, $\overline{x} = 10.48$, $\alpha = 0.05$, $s^2 = 0.056$,

因为
$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{14 \times 0.056}{0.0225} = 34.844$$
,

查表得 $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.975}(14) = 5.629$,

$$\chi_{\alpha/2}^{2}(n-1) = \chi_{0.025}^{2}(14) = 26.119$$
,

于是
$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{14 \times 0.056}{0.0225} = 34.844 > 26.119$$
,

所以拒绝 H_0 ,

认为该机切割的金属棒长度的标准差有显著变化.



例3 某厂生产的铜丝的折断力指标服从正态分布,现随机抽取9根,检查其折断力,测得数据如下(单位:千克): 289, 268, 285, 284, 286, 285, 286, 298, 292. 问是否可相信该厂生产的铜丝的折断力的方差为20? ($\alpha = 0.05$)

解 按题意要检验 $H_0: \sigma^2 = 20, H_1: \sigma^2 \neq 20,$ $n = 9, \quad \overline{x} = 287.89, \quad s^2 = 20.36,$ 查表得 $\chi^2_{0.975}(8) = 2.18, \quad \chi^2_{0.025}(8) = 17.5,$

于是 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{8 \times 20.36}{20} = 8.14$, 2.18 < 8.14 < 17.5,

故接受 H。认为该厂生产铜丝的折断力的方差为20.

例4 某自动车床生产的产品尺寸服从正态分布,按规定产品尺寸的方差 σ^2 不得超过0.1,为检验该自动车床的工作精度,随机的取25件产品,测得样本方差 s^2 =0.1975, \bar{x} = 3.86.问该车床生产的产品是否达到所要求的精度? (α = 0.05)

解 要检验假设 $H_0: \sigma^2 \le 0.1$, $H_1: \sigma^2 > 0.1$, n = 25, $\chi^2_{0.05}(24) = 36.415$,

因为
$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 0.1975}{0.1} = 47.4 > 36.415$$
,

所以拒绝 H_0 ,

认为该车床生产的产品没有达到所要求的精度.

二、两个总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2), N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的情况

设 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本,

 Y_1, Y_2, \dots, Y_n 为来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本,

且设两样本独立 ,其样本方差为 S_1^2, S_2^2 .

又设 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均为未知 ,

需要检验假设: $H_0: \sigma_1^2 \le \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$,



当
$$H_0$$
 为真时 , $E(S_1^2) = \sigma_1^2 \le \sigma_2^2 = E(S_2^2)$,

当
$$H_1$$
 为真时 , $E(S_1^2) = \sigma_1^2 > \sigma_2^2 = E(S_2^2)$,

当 H_1 为真时,观察值 $\frac{{S_1}^2}{{S_2}^2}$ 有偏大的趋势,

故拒绝域的形式为 $\frac{{S_1}^2}{{S_2}} \ge k$,

此处 k 的值由下式确定 :

$$P\{H_0$$
 为真,拒绝 $H_0\} = P_{\sigma_1^2 \le \sigma_2^2} \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \ge k \right\}$

$$\leq P_{\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2} \left\{ \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \geq k \right\}, \quad (因为 \sigma_1^2/\sigma_2^2 \leq 1)$$

要使 $P\{H_0$ 为真,拒绝 $H_0\} \leq \alpha$,

只需令
$$P_{\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2} \left\{ \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \geq k \right\} = \alpha.$$

根据第六章 § 2定理四知

定理四



$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1).$$

即 $k = F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

检验问题的拒绝域为
$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \ge F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

上述检验法称为 F 检验法.





例5 试对第八章第二节例4中的数据检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2. \quad (\mathbb{R} \ \alpha = 0.01)$$

 $\mathbf{m}_1 = n_2 = 10$, 拒绝域见表 8.1. **附表8-1**

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \ge F_{0.005} (10 - 1, 10 - 1) = 6.54$$

或
$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \le F_{1-0.005} (10-1, 10-1)$$

$$=\frac{1}{F_{0.005}(9, 9)}=\frac{1}{6.54}=0.153,$$



因为
$$s_1^2 = 3.325$$
, $s_2^2 = 2.225$,

所以
$$\frac{{s_1}^2}{{s_2}} = 1.49$$
,

$$0.153 < \frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.49 < 6.54,$$

故接受 H₀,认为两总体方差相等.

两总体方差相等也称两总体具有方差齐性.



例6 试对第七章第五节例9中的数据检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 \le \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2. \quad (\mathbb{R} \ \alpha = 0.1)$$

解 $n_1 = 18$, $n_2 = 13$, 拒绝域见表 8.2. 附表8-2

$$F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1) = F_{0.1}(18-1, 13-1) = 1.96,$$

拒绝域为
$$\frac{s_1^2}{s_2^2} \ge 1.96$$
,

因为
$$s_1^2 = 0.34$$
, $s_2^2 = 0.29$, $\frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.17 < 1.96$,

故接受 H₀,认为两总体具有方差齐性.

例7 两台车床加工同一零件,分别取6件和9件测

量直径,得: $s_x^2 = 0.345$, $s_y^2 = 0.357$. 假定零件直径 服从正态分布,能否据此断定 $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$.($\alpha = 0.05$)

解 本题为方差齐性检验:

$$H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2, \quad H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2.$$

$$F_{0.025}(5, 8) = 4.82, \quad F_{0.975}(5, 8) = 0.148,$$

取统计量
$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{0.345}{0.357} = 0.9644$$
,

$$0.148 < F < 4.82$$
, 故接受 H_0 ,认为 $\sigma_x^2 = \sigma_v^2$.

例8 分别用两个不同的计算机系统检索10个资料, 测得平均检索时间及方差(单位:秒)如下:

 $\bar{x} = 3.097$, $\bar{y} = 3.179$, $s_x^2 = 2.67$, $s_y^2 = 1.21$,假定检索时间服从正态分布,问这两系统检索资料有无明显差别? ($\alpha = 0.05$)

解 根据题中条件,首先应检验方差的齐性.

假设
$$H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2$$
, $H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$.

$$F_{0.025}(9, 9) = 4.03, \quad F_{0.975}(9, 9) = 0.248,$$

取统计量
$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{2.67}{1.21} = 2.12$$
,

0.248 < F = 2.12 < 4.03

故接受
$$H_0$$
, 认为 $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$.

再验证 $\mu_x = \mu_y$,

假设
$$H_0: \mu_x = \mu_y$$
, $H_1: \mu_x \neq \mu_y$.

取统计量
$$t = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

其中
$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$
.



当 H_0 为真时, $t \sim t(n_1 + n_2 - 2)$.

$$n_1 = 10$$
, $n_2 = 10$, $t_{0.05}(18) = 2.101$,

因为
$$t = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{3.097 - 2.179}{\sqrt{\frac{10(2.67 + 1.21)}{18} \cdot \sqrt{\frac{2}{10}}}}$$

$$= 1.436 < 2.101$$
, 故接受 H_0 ,

认为两系统检索资料时间无明显差别.



三、小结

- 1.单个正态总体方差的检验法 $--\chi^2$ 检验法;
- 2. 两个正态总体方差的检验法 --F 检验法;

正态总体均值、方差的检验法见下表 (显著性水平为α)



	原假设 H ₀	检验统计量	备择假设 <i>H</i> ₁	拒绝域
1	$\mu \le \mu_0$ $\mu \ge \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 己知)$	$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \ge z_{\alpha}$ $z \le -z_{\alpha}$ $ z \ge z_{\alpha/2}$
2	$\mu \le \mu_0$ $\mu \ge \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 未知)$	$t = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \ge t_{\alpha}(n-1)$ $t \le -t_{\alpha}(n-1)$ $ t \ge t_{\alpha/2}(n-1)$
3	$\mu_1 - \mu_2 \le \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \ge \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 己知)$	$Z = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$z \ge z_{\alpha}$ $z \le -z_{\alpha}$ $ z \ge z_{\alpha/2}$
4	$\mu_1 - \mu_2 \le \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \ge \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 未知)$	$t = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 2)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$t \ge t_{\alpha} (n_1 + n_2 - 2)$ $t \le -t_{\alpha} (n_1 + n_2 - 2)$ $ t \ge t_{\alpha/2} (n_1 + n_2 - 1)$

	原假设 H ₀	检验统计量	备择假设 <i>H</i> ₁	拒绝域
5	$\sigma^2 \le \sigma_0^2$ $\sigma^2 \ge \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(\mu$ 未知)	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^{2} > \sigma_{0}^{2}$ $\sigma^{2} < \sigma_{0}^{2}$ $\sigma^{2} \neq \sigma_{0}^{2}$	$\chi^{2} \geq \chi_{\alpha}^{2}(n-1)$ $\chi^{2} \leq \chi_{1-\alpha}^{2}(n-1)$ $\chi^{2} \geq \chi_{\alpha/2}^{2}(n-1)$ $\chi^{2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^{2}(n-1)$
6	$\sigma_1^2 \le \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \ge \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $(\mu_1, \mu_2 $ 未知)	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_{\alpha}(n_{1}-1, n_{2}-1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_{1}-1, n_{2}-1)$ $F \geq F_{\alpha/2}(n_{1}-1, n_{2}-1)$ $F \geq F_{1-\alpha/2}(n_{1}-1, n_{2}-1)$
7	$\mu_{\scriptscriptstyle D} \leq 0$ $\mu_{\scriptscriptstyle D} \geq 0$ $\mu_{\scriptscriptstyle D} = 0$ (成对数据)	$t = \frac{\overline{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}}$	$\mu_{D} > 0$ $\mu_{D} < 0$ $\mu_{D} \neq 0$	$t \ge t_{\alpha} (n-1)$ $t \le -t_{\alpha} (n-1)$ $ t \ge t_{\alpha/2} (n-1)$